PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305917

(43) Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

(21)Application number : 03-094863

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

(72)Inventor: OZEKI HISAO

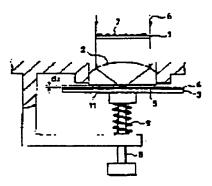
MATSUBARA TAKASHI

(54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To thin film thickness of an immersion liquid and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: The adhesive surface 11 of an exposure lens is hydrophilic—treated by a hydrophilic solution such as alcohol. A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on the hydrophilic—treated adhesive surface 11 through an immersion liquid 5, and the pattern 7 of a photomask 1 is transferred onto the wafer 3 by the irradiation of irradiation light 6. Wafer absorbing properties are improved in the hydrophilic—treated adhesive surface 11, and the film thickness of the immersion liquid 5 is made thin.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

http://www19.ipdl.jpo.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAeeaGrbDA404305917P1.htm

11/6/03

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出關公與各号

特開平4-305917

(43)公債日 平成4年(1992)10月28日

(51)IntCL' H01L 21/027	識別配号	庁內臺經番号	F I		技術表示管所
		7013—4 <u>M</u> 7352—4 M	H01L 2L/30	341 S 311 A	

容質請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

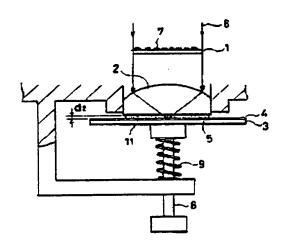
(21) 出題番号	特度平3-84863	(71)出題人	000004112 株式会社ニコン
(22) 出頭日	平成3年(1991)4月2日		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
		(72) 発明者	大路 尚夫
		ł	東京都島川区西大井一丁目6番3号 株式
		į	会社ニコン大井製作所内
		(72) 発明者	松原隆
		1	東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式
			会社ニコン大井製作所内
		(74)代班人	分理士 山川 政党

(54) 【発明の名称】 密管数質光装置

(57) 【要約】

(自的) 布着型魔光袋話において、没徳の順厚を持く して光の吸収量を少なくし、電光ムラを軽減助止するこ とを目的とする。

【特成】 総光レンズの参替面11をアルコール等の親木溶液によって提水化処理する。この親水化処理された 密若面11にフォトレジスト4を動布されたウエハ3を 浸紋5を介して密着させ、開射光6の原射によりフォトマスク1のパターンでをウエハ3上に転写する。 観水化処理された歯若面11は、吸水性が向上し、浸液5の膜 厚を薄くする。



--97-

【特許請求の範囲】

【讃文項1】 投影光学系もしくはフォトマスクのウエ 八倍若面を観水化処理し、この観水化処理された密着官 にフォトレジストを適布されたウエハを提抜を介して密 若させ、揺射光の風射によりフォトマスクのパターンを 前記フォトレジストに転写するようにしたことを特徴と する病者型露光萎促。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程にお 20 いて、フォトマスク上のパターンをウエハ上に投影席光 する露光装包、特に伝管型露光被置に関するものであ る.

[0002]

【従来の技術】レーザー光等を照射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導 体拡紅上に投影線光するこの種の第光袋室における解光 方式としては、①密着 (コンタクト) 電光方式、②プロ キシミティ観光方式、③反射型投影観光方式、④縮小レ ンズ公形属光方式の4方式が知られている。

【9093】このうち密着露光方式は、フォトマスク (または投影光学系) とウエハとを密着させて電光する もので、これらが完全に告着している場合には、フォト レジスト中の波長が風折率分の1に短くなるため、国折 の影響が少なく、路解像度の転写が得られるという特色 を有している。しかし、完全な密碧を実現することは観 めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的に接 触させているためにウエハ衰菌の突起等によりフォトマ スクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時にデバ イスの歩程りに影響を及ぼすといった問題があった。

【0004】そこで、宿袋無光方式によるこのような時 超を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に被体 (浸酸)を光環している。図2は投影光学系にウエハを 告着させた場合を示すもので、1はフォトマスク、2は 投影光学系の一部を構成する鑑光レンズ、3はフォトレ ジスト4が整布されたウエハ、5は軽光レンズ2とウエ ハ3間に充塡された侵族、6はフォトマスク1のパター ン?を思射しファトレジスト4を露光する照射光、8は ウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付勢 である。風射光6の放長は短いほど回折の影響が少な く、そのため光源としてエキシマレーザー等のレーザー 徳霞が用いられる。 役後5 としては、屈折率がフォトレ ジスト4と同程度で光の吸収が少なく、しかもフォトレ ジスト4を確かさないものが建ましく、過常純水が使用 される.

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上述し たような受飲るを使用した密着型像光线管においては、 浸渍 5 自身の腹厚ムラがあると、浸渍 5 による照射光 6 50 電光装置によれば、投影光学系をたはフォトマスクのウ

の吸収量にムラが生じるため、コンタクト電光されたフ オトレジスト4のパターンが的確に鑑光されている部分 とそうでない部分とが生じてしまうという問題があっ た。したがって、このような観光ムラの発生を防止する ため、役被5の競撃は1を得くし、光の吸収ムラを少な くすることが望まれている。

【0006】本発明は上途したような従来の問題点およ び収益に進みてなされたもので、その目的とするところ は、湿臓の腹壁を導くし、露光ムラを軽減防止し得るよ うにした密若型部光裳屋を提供することにある。

[0007]

【疎観を解決するための手段】本発明は上記目的を達成 するため、投影光学系もしくはフォトマスクのウエハ密 **着面を観水化処理し、この根水化処理された密着面にフ** ォトレジストを整布されたウエハを浸痰を介して密管さ せ、服射光の照射によりフォトマスクのパターンを前配 フォトレジストに転写するようにしたものである。

[8000]

[作用] 本発明において、職水化処理された投影光学系 20 もしくはフォトマスクのウエハ告着画は、吸水性が向上 し、受液の膜厚を誇くする。

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る審着型は光装置の 一奏絵例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一緯度部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を省略する。本実施例は投影光学系にウエハを表 粉させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の 一郎を構成する舅光レンズ2のウエハ密若面11を予め か 親水化処理し、この鴨水化処理された機常面11にウエ ハ3を拡水等の受抗5を介して衝着させ、照射光6の限 射によりフォトマスク1のパターン7をウエハ3上に転 写するようにしたものである。

[0010] 短水化処理は、アルコール系等の頼水溶液 で密着面11を奇麗に拭き、レンズ表面の汚れを取るこ とで行なわれる。そして、この親水化処理後密着面11 にウエハ3を接接を全介して密封させ、ウエハ3を算光 レンズ2にばわ9により所定圧にて押しつける。

【0011】 かくしてこのような構成においては、戦水 しウエハ3を露光レンズ2に押し付ける圧縮コイルばね 40 化処理によって密着面11の吸水性を向上させているの で、観水化処理を施さなかったときと比較して浸液5の 吸水効果が大きく、したがって、投液5の衰間張力が小 さくなって濡れ性が上がるため、役故5の誤俘d2 を図 2に示した従来装置と比較して輝くする (d2 <d1) ことができ、また旗原が強くなれば光の吸収量も少なく なるので、これに比例して光の吸収ムラが減少し、軽光 ムラを経済防止することができる。

[0012]

[発明の効果] 以上説明したように本ி明に係る密着部

(3)

特別平4-305917

エハ密岩面を製水化処理し、この根水化処理された密滑 図に、フォトレジストを独布されたウエハを根液を介し て密着させるように構成したので、民族自身の表面製力 を減らして濡れ性を向上させることができる。したがっ て、侵波の鎮厚を輝くするかでき、また観厚が悪くなれ ば役核の銭厚ムラも少なくなるため、光の吸収が少な く、受液による軽光ムラを軽減防止することができる。 【図面の簡単な説明】

【四1】本発明に係る密着型離光装置の一翼旋倒を示す 要銀の断面図である。

【図2】 密着型路光装型の従来例を示す妥協の新面図で

ある.

【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 第光レンズ
- 3 ウエハ
- 4 フォトレジスト
- 5 浸渍
- 6 照射光
- 7 マスク
- 10 11 密着面

